



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ
СВОЙСТВ ПОВЕРХНОСТИ И ВАКУУМА"



Свидетельство
об аттестации методики (метода) измерений
№ 5/RA.RU320052-2020

Методика измерений *магнитооптических параметров и доменной структуры изделий нано- и микросистемной техники* разработанная *Национальным исследовательским университетом «Московский институт электронной техники»*,

124498, г. Москва, г. Зеленоград, площадь Шокина, д. 1

и регламентированная в документе *«Магнитооптические параметры и доменная структура изделий нано- и микросистемной техники. Методика измерений с помощью установки для измерения магнитооптических параметров ВН-Р17892»*, утвержденном в 2020 году и содержащем 18 страниц, аттестована в соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений» в порядке, предусмотренном приказом Минпромторга России от 15.12.2015 г. № 4091.

Аттестация осуществлена по результатам *экспериментально-расчетного оценивания показателей точности измерений, выполненных с использованием аттестуемой методики измерений.*

В результате аттестации установлено, что методика измерений соответствует предъявляемым к ней требованиям и обладает следующими показателями точности:

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений (при доверительной вероятности $P=0,95$) коэрцитивной силы и силы анизотропии магнитных пленок не превышают границ $\pm 5\%$ в диапазоне от -8000 до +8000 А/м в параллельном поле и в диапазоне от -160000 до +160000 А/м в перпендикулярном поле относительно расположения образца.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений (при доверительной вероятности $P=0,95$) размеров доменов доменной структуры не превышают границ $\pm(0,5+0,03L)$ мкм в диапазоне от 1 до 200 мкм, где L – размер домена, выраженный в мкм.

Главный метролог

Начальник отдела



С.В. Бондарчук

В.Б. Митюхляев

Дата выдачи: «10» сентября 2020 г.